

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **05005897 A**

(43) Date of publication of application: **14 . 01 . 93**

(51) Int. Cl.  
**G02F 1/1343**  
**G02F 1/133**  
**G02F 1/136**

(21) Application number: **03159163**

(22) Date of filing: **28 . 06 . 91**

(71) Applicant: **SHARP CORP**

(72) Inventor:  
**YAMASHITA TOSHIHIRO**  
**MATSUSHIMA YASUHIRO**  
**SHIMADA NAOYUKI**  
**TAKATO YUTAKA**

(54) **METHOD FOR CHECKING ACTIVE MATRIX  
SUBSTRATE**

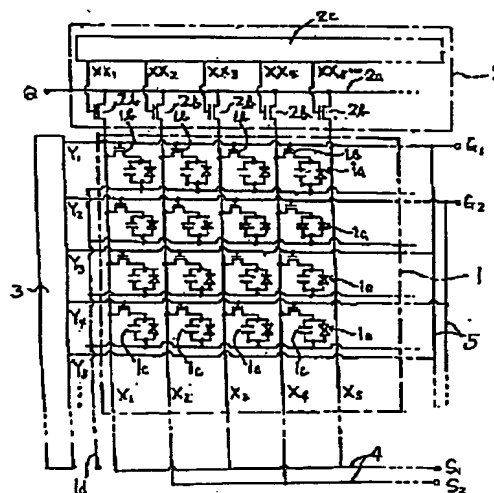
and 5 are removed after the end of check.

COPYRIGHT: (C)1993,JPO&Japio

(57) Abstract:

**PURPOSE:** To easily and surely check a defect by providing a signal line for check connected to the other end of a data signal line and checking a data signal line driving circuit and the data signal line based on the output from a video signal line.

**CONSTITUTION:** Two signal lines 4 for data check to which data signal lines X are alternately connected are formed on the terminal side of data signal lines X from a data signal line driving circuit 2 to a picture element part 1, and data check signal input terminals S are provided in their end parts. Two signal lines 5 for scanning check to which scanning signal lines Y are alternately connected are formed on the terminal side of scanning signal lines Y from a scanning signal line driving circuit 3 to the picture element part 1, and scanning check signal output terminals G are provided in their end parts. In this case, check is performed through signal lines 4 for data check and signal lines 5 for scanning check in the terminals of data signal lines X and scanning signal lines Y, and these signal lines 4



(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-5897

(43)公開日 平成5年(1993)1月14日

(51)Int.Cl. <sup>3</sup>	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 2 F	1/1343	9018-2K		
	1/133	5 5 0	7820-2K	
	1/136	5 0 0	9018-2K	

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全 11 頁)

(21)出願番号	特願平3-159163	(71)出願人	000005049 シャープ株式会社 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
(22)出願日	平成3年(1991)6月28日	(72)発明者	山下 俊弘 大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内
		(72)発明者	松島 康浩 大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内
		(72)発明者	島田 尚幸 大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内
		(74)代理人	弁理士 山本 秀策
			最終頁に続く

(54)【発明の名称】 アクティブマトリクス基板の検査方法

(57)【要約】

【構成】データ信号線X及び走査信号線Yの端末に形成したデータ側検査用信号線4及び走査側検査用信号線5を介して検査を行うと共に、検査終了後にこれらのデータ側検査用信号線4及び走査側検査用信号線5を除去する。

【効果】1本又は2本のデータ側検査用信号線4及び走査側検査用信号線5によって、多数の出力を有するデータ信号線駆動回路2や走査信号線駆動回路3及び多数のデータ信号線Xや走査信号線Y等の欠陥を容易かつ確実に検査することができる。

